

参加者からの声

- ・ Aさん：
所属研究室でAFM装置は使用してきましたが大気中での測定が中心であったので、今回の研修を通してAFM測定の測定対象や使用環境を広げた際の計測のポイントを学ぶことが出来、今後の研究でさらに新しい実験テーマに取り組むきっかけをつかむことが出来ました。新しい装置に触れることもでき、ご対応いただいた分子研の研究者および装置メーカーの方々に感謝いたします。
- ・ Bさん：
とても和やかな雰囲気の中で、有意義な研修を受けさせていただきました。質問にもわかりやすく丁寧に答えていただき、感謝しております。皆様、本当にありがとうございました！
- ・ Cさん：
初心者で参加させて頂きましたが、そんな私にも理解できるよう丁寧なプログラムをご準備頂き、ありがとうございました。今後、装置を導入予定なので、教えて頂けたことを活かしていきたいと思います。また、他機関の技術スタッフの方との交流で、お話をすることができたところも大変うれしく、参加させて頂けて良かったです。ありがとうございました。
- ・ Dさん：
走査プローブ顕微鏡に全く触れたことがありませんでしたが、今回新しい測定技術を学ぶ機会を与えていただき、大変感謝しております。参加者の個々の経験や技術に配慮したきめ細やかなプログラムを組んで頂いたので、3日間の研修に最後までついていくことができました。スタッフの皆様、研修で一緒にできた皆様、どうもありがとうございました。
- ・ Eさん：
研究室のテーマで今後、「走査プローブ顕微鏡」を使用する可能性があり、特に磁場TUNA測定を学びたいと思い、参加させていただきました。走査プローブ顕微鏡についてはほとんど知識がありませんでしたが、今回の研修で教授していただき大変勉強になりました。
- ・ Fさん：
基本的な測定では、どのように支援するかを勉強させていただきました。島津の最新の装置の使い方を教えていただいた時は、普段使用している装置と比較し、レーザーの位置合わせなどが自動になっていて、簡単に測定できる装置だと思いました。お昼ご飯を外部の方と一緒にさせていただき、楽しく交流できました。ありがとうございました。